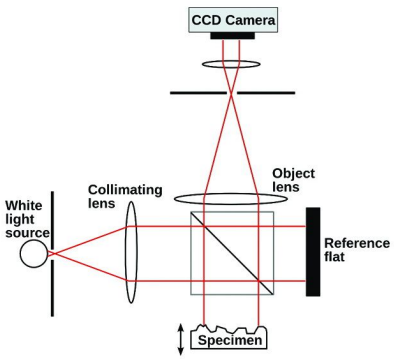
MOA-ZA

رویه نگار اپتیکی سطح

(تداخل سنجی نور سفید)

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی نور سفید به بررسی رویه اجسام می پردازد ، به این صورت که با ترکیب منبع نور سفید ، سیستم اپتیکی و سنسور CCD فاصله شیئی تا اجسام مشخص می شود.



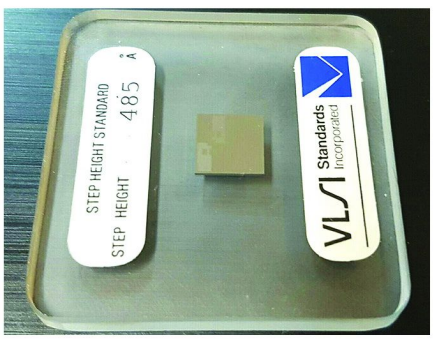
بازه ی اندازه گیری این روش از مرتبه ی نانومتر تا میلیمتر است. دقت اندازه گیری در این روش وابسته به همدوسی منبع نور، دقت و تکرارپذیری استیج عمودی، مقاومت در برابر لرزش، بازتاب پذیری و زبری سطح نمونه، و خطای سنسور CCD است.

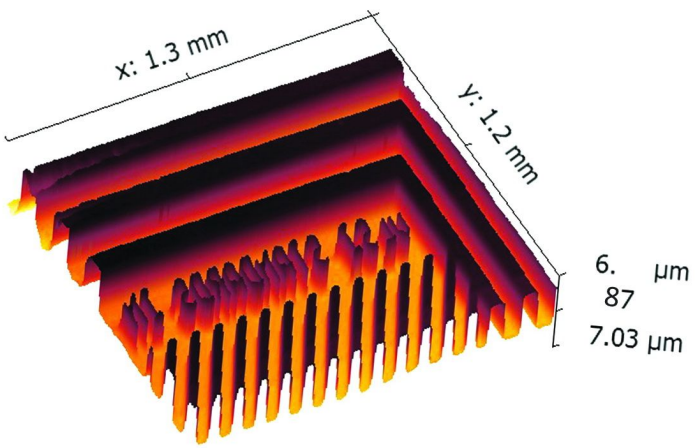
با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها دستگاه MOA-ZA دارای دقت ۵ نانومتر است.

نمونه مورد بررسی بر روی استیج در راستای عمودی حرکت می نماید و سنسور پس از هر حرکت یک تصویر از نمونه ثبت می کند.

پس از دریافت داده ها این اطلاعات توسط نرم افزار gwyddion نمایش داده می شوند که در این نرم افزار با توجه به نیاز می توان به بررسی زبری، ارتفاع پوشش، شکل جسم و ... پرداخت.

شکل زیرنمونه ی ۴۸۵ آنگستورومی شرکت VLSI Standards است که توسط دستگاه MOA-ZA اندازه گیری شده است.تصویر زیر ، نمایی سه بعدی از نمونه ی مذکور را ارائه می دهد. همان طور که مشاهده می گردد پروفایل سطح نمونه به وضوح قابل تشخیص است.





تهران ، امیر آباد شمالی ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، ساختمان شماره ۲ ، واحد ۴۰۲ ، شرکت فناوری کهربا

کد پستی : ۱۴۳۹۸۱۱۷۴۳۵ تلفن : ۸۶۰۹۴۱۰۲ تلفکس : ۸۶۰۹۳۲۰۵

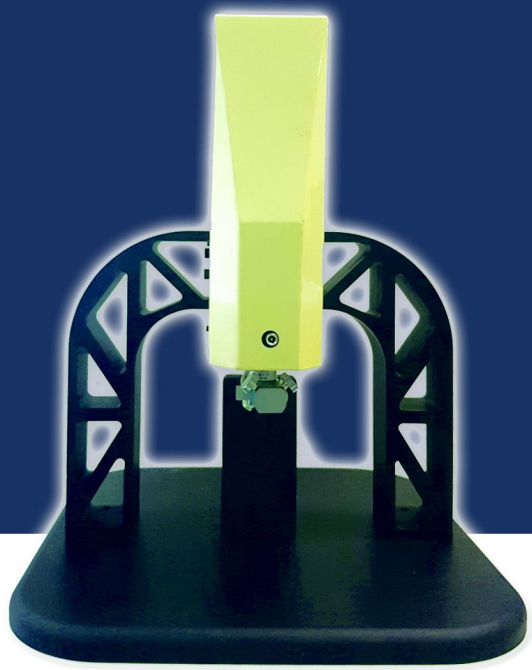
www.fanavari-kahroba.com info@fanavari-kahroba.com

شرکت فناوری کهربا

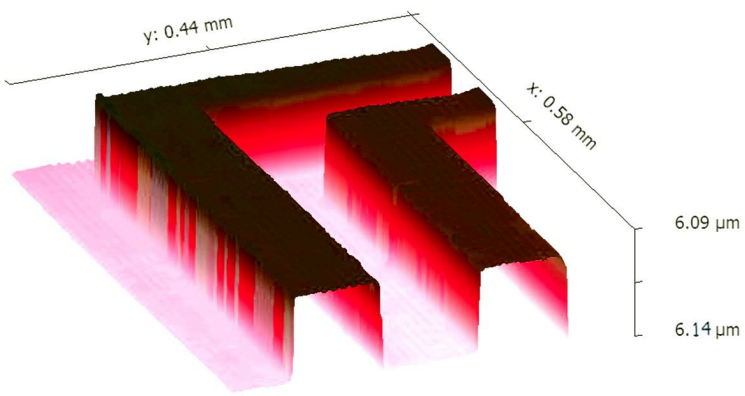
MOA-ZA

رویه نگار اپتیکی سطح

(تداخل سنجی نور سفید)



اندازه گیری توپوگرافی سطح با دقت نانومتر
سایز پنجره اسکن ۱میلیمتر در ۱,۲ میلیمتر
توانایی اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع ۱۰ میلیمتر
توانایی اندازه گیری ضخامت، زبری، پروفایل و ...
امکان نمایش در نرم افزارهای پروفایلومتری
سرعت اندازه گیری بالا



تهران ، امیر آباد شمالی ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، ساختمان شماره ۲ ، واحد ۴۰۲ ، شرکت فناوری کهربا
کد پستی : ۱۴۳۹۸۱۱۷۴۳۵ تلفن : ۸۶۰۹۴۱۰۲ تلفکس : ۸۶۰۹۳۲۰۵
www.fanavari-kahroba.com info@fanavari-kahroba.com